【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【 発 行 日 】 平 成 23年2月10日 (2011.2.10)

【公開番号】特開2009-155111(P2009-155111A)

【公開日】平成21年7月16日(2009.7.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-028

【出願番号】特願2007-328744(P2007-328744)

【国際特許分類】

C 0 1 B 31/02 (2006.01) B 8 2 B 3/00 (2006.01) B 0 1 J 23/755 (2006.01)

[F I]

C 0 1 B 31/02 1 0 1 F

B 8 2 B 3/00

B 0 1 J 23/74 3 2 1 M

【手続補正書】

【提出日】平成22年12月17日(2010.12.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

底部を有する凹部(3)を基体(S)の所定の位置に形成する工程と、

基体(S)に触媒ナノ粒子(5、6)を供給する工程と、

凹部(3)の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子(6)を選択的に取り除く工程と

を含むことを特徴とする基体(S)に触媒ナノ粒子(5)を形成する方法。

【請求項2】

基体(S)に触媒ナノ粒子(5、6)を供給する工程が、

基体(S)に少なくとも1つの触媒材料層(4)を供給し、触媒材料が凹部(3)の少なくとも底部を覆う工程と、

少なくとも1つの触媒材料層(4)をナノ粒子(5、6)に分割する工程と、

により為されることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項3】

少なくとも 1 つの触媒材料層(4)をナノ粒子(5 、 6)に分割する工程が、熱および/またはプラズマ支援法により為されることを特徴とする請求項 2 に記載の方法。

【請求項4】

基体(S)に触媒ナノ粒子(5、6)を供給する工程が、

ナノ粒子(5、6)と溶媒とを含む溶液よりナノ粒子(5、6)を基体(S)に析出する工程と、

ナノ粒子(5、6)を析出後、溶媒を取り除く工程と、

により為されることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項5】

溶媒を取り除く工程が、蒸発により為されることを特徴とする請求項4に記載の方法。

【請求項6】

凹部(3)の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子(6)を選択的に取り除く工程が

犠牲材料(7)を基体(S)に堆積し、犠牲材料(7)が少なくとも凹部(3)の底部に供給されたナノ粒子(5)を覆う工程と、

凹部(3)の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子(6)を取り除く工程と、

犠牲材料(7)を取り除く工程と、

により為されることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項7】

犠牲材料(7)を取り除く工程が、湿式洗浄方法により為されることを特徴とする請求項6に記載の方法。

【請求項8】

凹部(3)の端部から不純物(8)を取り除く工程を更に含むことを特徴とする請求項7に記載の方法。

【請求項9】

凹部(3)の端部から不純物(8)を取り除く工程が、基体(S)を H_2 SO $_4$: H_2 O $_2$ が1:4の溶液に5分間浸漬することにより為されることを特徴とする請求項8に記載の方法。

【請求項10】

凹部(3)を基体(S)の所定の位置に形成する工程が、基体(S)の所定の位置に凹部(3)をエッチングして為されることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項11】

エッチングの前に、基体(S)にリソグラフィー法により所定の位置を規定する工程を 更に含むことを特徴とする請求項10に記載の方法。

【請求項12】

基体(S)がベース基体(1)を含み、凹部(3)を基体(S)の所定の位置に形成する工程がベース基体(1)に凹部(3)を形成して為されることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項13】

基体(S)がベース基体(1)と誘電体層(2)とを含み、凹部(3)を基体(S)の 所定の位置に形成する工程が誘電体層(2)に凹部(3)を形成して為されることを特徴 とする請求項1に記載の方法。

【請求項14】

基体(S)に細長いナノ構造体(9)を成長させる方法への請求項1記載の方法の使用

【請求項15】

底部を有する凹部(3)を基体(S)の所定の位置に形成する工程と、

基体(S)に触媒ナノ粒子(5、6)を供給する工程と、

凹部(3)の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子(6)を選択的に取り除く工程と

凹部(3)の底部に供給されたナノ粒子(5)を触媒として用いて、凹部(3)に細長いナノ構造体(9)を成長させる工程と、

を含むことを特徴とする基体(S)に細長いナノ構造体(9)を形成する方法。

【請求項16】

基体(S)に触媒ナノ粒子(5、6)を供給する工程が、

基体(S)に少なくとも1つの触媒材料層(4)を供給し、触媒材料が凹部(3)の少なくとも底部を覆う工程と、

少なくとも1つの触媒材料層(4)をナノ粒子(5、6)に分割する工程と、

により為されることを特徴とする請求項15に記載の方法。

【請求項17】

少なくとも 1 つの触媒材料層(4)をナノ粒子(5、6)に分割する工程が、熱および/またはプラズマ支援法により為されることを特徴とする請求項16に記載の方法。

【請求項18】

基体(S)に触媒ナノ粒子(5、6)を供給する工程が

ナノ粒子(5、6)と溶媒とを含む溶液よりナノ粒子(5、6)を基体(S)に析出する工程と、

ナノ粒子(5、6)を析出後、溶媒を取り除く工程と

により為されることを特徴とする請求項15に記載の方法。

【 請 求 項 1 9 】

溶媒を取り除く工程が、蒸発により為されることを特徴とする請求項18に記載の方法

【請求項20】

細長いナノ構造体(9)の成長が、化学気相成長法により為されることを特徴とする請求項15に記載の方法。

【請求項21】

細長いナノ構造体(9)を成長させる工程が、

カーボンソースとアシスタントガスとを供給する工程と、

基体(S)を加熱することにより細長いナノ構造体(9)を成長させる工程と、

を含むことを特徴と請求項20に記載の方法。

【請求項22】

細長いナノ構造体(9)を成長させる工程が、基体(S)を600 から800 の間の温度に加熱して為されることを特徴とする請求項21の方法。

【請求項23】

凹部(3)の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子(6)を選択的に取り除く工程が

犠牲材料(7)を基体(S)に堆積し、犠牲材料(7)が少なくとも凹部(3)の底部に供給されたナノ粒子(5)を覆う工程と、

凹部(3)の底部と異なる位置に供給されたナノ粒子(6)を取り除く工程と、

犠牲材料(7)を取り除く工程と、

により為されることを特徴とする請求項15に記載の方法。

【請求項24】

基体(S)がベース基体(1)を含み、凹部(3)を基体(S)の所定の位置に形成する工程がベース基体(1)に凹部(3)を形成して為されることを特徴とする請求項15に記載の方法。

【請求項25】

基体(S)がベース基体(1)と誘電体層(2)とを含み、凹部(3)を基体(S)の 所定の位置に形成する工程が誘電体層(2)に凹部(3)を形成して為されることを特徴 とする請求項15に記載の方法。

【請求項26】

細長いナノ構造体(9)の成長がベース成長により為されることを特徴とする請求項 1 5 に記載の方法。

【請求項27】

細長いナノ構造体(9)の成長がチップ成長により為されることを特徴とする請求項 15 に記載の方法。

【請求項28】

半導体製造工程での請求項15に記載の方法の使用。